**

**雷尼绍加强了inVia共焦显微拉曼光谱仪全面的成像选项**

**雷尼绍将在Pittcon 2015展会上展出inVia共焦显微拉曼光谱仪，时间为2015年3月8日–12日，地点在美国新奥尔良市的Ernest N. Morial会议中心 (Ernest N. Morial Convention Center)。**

inVia系统使用户能够利用最全面的拉曼成像技术研究最广泛的样品种类。雷尼绍独有的一系列互补的成像选项允许用户轻松获得他们所需要的化学和结构信息。在2808展位，雷尼绍专家将讲解每种成像技术集合后的综合效益，以及增加透射拉曼如何能提供最大的灵活性。

应用科学家Pippa Law将于3月9日下午2:30作关于透射拉曼的报告。她将讲解透射拉曼对于快速定量分析块状材料均匀性来说是一种多么具有吸引力的方法。通过聚焦药品，她将演示透射拉曼在分析诸如药片剂量和混合物均一性等应用方面的显著效益。

欢迎在Pittcon展会上莅临雷尼绍展台，或联系您当地的销售代表，了解inVia共焦显微拉曼光谱仪如何生成优质的拉曼图像。

图片：描绘SiC晶圆的不同晶体多型体的拉曼图像。

**-完-**